高出力超短パルスレーザーの

単純化および低価格化のための技術開発

福井大学 学術研究院工学系部門 准教授 川戸 栄

(2018 年度 一般研究開発助成 AF-2018223-B3)

キーワード: 超短パルスレーザー, モード同期, 半導体レーザー励起

1. 研究の目的と背景

高出力, すなわち, 高平均出力かつ高エネルギーの超短 パルスレーザーは, 金属をはじめとした様々な材料の超精 密加工の研究に用いられている. これらの研究の実用化お よび産業化に対する最大の問題は, レーザーの価格が数千 万円以上と極めて高価なことにある. この問題の生じる根 本的な理由は, レーザーの装置構成が複雑であり, かつ効 率も極めて低いことに起因している.

まず,高出力超短パルスレーザーはモード同期レーザー 発振器と増幅器で構成されている.この中で特に増幅器が 大型かつ複雑なため,装置全体が複雑になる.装置の制御 のために熟練された技術を必要とする場合も多い.さらに, 製作には高価な部品も多数必要とする.例えば,増幅器か らの戻り光の防止のために数10万円クラスの高価なアイ ソレーターが必要であり,増幅器には高速光スイッチとし て用いるために数百万円クラスの高価なポッケルスセル が必要になる.

また効率に関しては、例えば、出力 mJ 級、パルス幅が 数100 fs 級のレーザーの効率は数%以下である.このパル ス幅を10分の1にするためには、さらに桁違いに効率が 低下する.出力向上には大型の増幅器と励起用の高価な高 出力レーザーが必要になり、価格がさらに上昇する.

このため、本研究では、高出力超短パルスレーザーの理 論を構築し、この理論を用いて単純化および低価格化を実 現するための手法を開発することを目的とした.まず、安 価なエッジエミッター型の半導体レーザーを励起光源と して、レーザー利得媒質を高密度励起することにより、損 失による効率低下を克服し、量子限界に近い高効率化が実 現できることを明らかにした.また、高密度励起に起因す る光学歪や、半導体レーザーの低ビーム品質や高収を差に 起因する効率低下も、高密度励起により克服できることを 明らかにした.

出力パルスに関しては,連続波モード同期固体レーザー の共振器内部に高非線形性材料を挿入して自己位相変調 を増強制御することにより利得帯域の限界を超える超短 パルス化ができることを明らかにした.さらに,高密度励 起により,従来に比べて桁違いに高い損失変調が可能にな ることに着目し,モード同期の損失変調を従来よりも極め て高くすることにより,自己位相変調を用いずに高速化飽 和吸収体だけを用いても,利得帯域の限界を超える広帯域 化と超短パルス化ができることを明らかにした.

2. 理論

2・1 準3(4)準位レーザーの効率に関する理論解析^{1,2)} 本研究では準3(4)準位系のYb:YAGを利得媒質とした. まず、レーザーの効率に関する理論解析では、準3(4)準位 レーザーに関するレート方程式を用いた.まず、単純化の ために、利得媒質への入射励起パワーP_pを規格化したパラ メーターである励起指数Fおよび、共振器内部パワーP_Lを 規格化したパラメーターである共振器内部光子指数Sを以 下の式で定義する.

$$F \equiv \frac{2f\sigma_{\rm em} \tau \, l \, \eta_{\rm p} \, \eta_{\rm a} \, P_{\rm p}}{h\nu_{\rm p} \, L \, V_{\rm L}} \tag{1}$$

$$S \equiv \frac{2f\sigma_{\rm em} \tau \, l \, P_{\rm L}}{h\nu_{\rm L}V_{\rm L}} \tag{2}$$

ここで、利得媒質の長さをl、励起量子効率を η_p 、励起光子 エネルギーを hv_p 、レーザー光子エネルギーを hv_L 、利得媒 質中のレーザーモード体積を V_L 、また、レーザー上準位と 下準位の局所ボルツマン分布 f_1 および f_2 の和をfとする. また、準4準位レーザーの下準位損失を除き、かつ、透過 率Tの出力鏡による損失を含めた共振器内部の全損失Lは、 共振器の残留損失 L_i を用いて、

$$L = L_{\rm i} - \ln (1 - T) \tag{3}$$

と表せる.

入射励起パワー P_p に対するレーザー出力 P_o の比, すなわち, 光光変換効率 η_{oo} は, 励起指数Fと光子指数Sを用いて以下の式で表すことができる.

$$\eta_{\rm oo} \equiv \frac{P_{\rm o}}{P_{\rm p}} = \eta_{\rm c} \eta_{\rm p} \eta_{\rm q} \eta_{\rm a} \frac{S}{F} \tag{4}$$

ここで, 共振器内部と出力の間の結合効率 η_c と原子量子効率 η_g は,

$$\eta_{\rm c} \equiv \frac{2T}{(2-T)L} \tag{5}$$

$$\eta_{\rm q} \equiv \frac{h\nu_{\rm L}}{h\nu_{\rm p}} \tag{6}$$

である.

連続波励起,定常状態のときの励起指数と共振器内部光 子指数の関係は,レーザー発振時には共振器内部で増幅さ れたパワーと損失により失われたパワーが一致するとい う条件から,

$$F = \frac{1 + B \int \frac{\phi_0}{1 + S V_L \phi_0} dV}{V_L \int \frac{r_P \phi_0}{1 + S V_L \phi_0} dV}$$
(7)

$$B \equiv \frac{2f_1 n_{\rm L} \sigma_{\rm em} \, l}{l} \tag{8}$$

となる.ここで、利得媒質内の励起分布関数 r_p とレーザー 分布関数 ϕ_0 は、以下の式で規格化されている.

$$\int r_{\rm p} dV = \int \phi_{\rm o} dV = 1 \tag{9}$$

レーザー発振閾値における励起指数は,

$$F_{\rm th} = (1+B)\frac{V_{\rm eff}}{V_{\rm L}} \tag{10}$$

となる.ここで、実効モード体積は、

$$V_{\rm eff} \equiv \frac{1}{\int r_{\rm p} \phi_{\rm o} dv} \tag{11}$$

である.パルス発振のときも,パルス幅とパルス繰り返し 時間の両方が蛍光寿命に比べて十分短ければ,定常状態を 同じとみなすことができるため,上記の条件で効率を解析 した.

励起光源にはエッジエミッター型の半導体レーザーを 想定し,速軸を垂直方向,遅軸を水平方向とした.エッジ エミッター型の半導体レーザーは,他(ベクセル型やフォ トニッククリスタル型)に比べて単位パワーあたりのコス トが安価(~0.1万円/W)であるが,輝度が低い(単位M² あたりのパワー~1W/M²)という欠点がある.エミッター が一つ(シングルエミッター型)の半導体レーザーの最大 出力は10W程度であり,速軸方向のビーム品質M²は1程 度と低い(良い)が,単位あたりM²のパワーが~1W/M² であるため,遅軸方向のビーム品質M²は10程度と高い (悪い).

シングルエミッター型の半導体レーザーを遅軸方向に 並べたものがリニアアレイ型の半導体レーザーであり,最 大出力は100 W クラスである. このリニアアレイ型半導 体レーザーのビーム品質は,速軸方向はシングルエミッタ ーと同様に良いが,遅軸方向はシングルエミッターを並べ た数の倍数だけ悪くなる. これ以上の出力は,リニアアレ イ型を速軸方向に積んだ形のスタック型半導体レーザー により得られる. この遅軸方向のビーム品質はリニアアレ イと同様であるが,速軸方向がリニアアレイを積んだ数の 倍数だけ悪化する. このように,エッジエミッター型の半 導体レーザーは,出力が高いほどそれに比例してビーム品 質M²が高くなる (ビーム品質が低下する). このため,エ ッジエミッター型の半導体レーザーを励起光源として出 力を向上させるには,この低ビーム品質に起因する効率低 下を克服する必要がある.

2・2 共振器内部の非線形波動伝搬に関する理論

本研究で想定している高出力超短パルスレーザーの概 念図を図1に、対応する数値解析のブロック図を図2に 示す.レーザー共振器内部の非線形波動伝搬の解析では、 共振器内部のパルスの電場波形の包絡線A(Z,t)(往復回数 Z,時間t,単位 \sqrt{W})に関する拡張された非線形シュレデ ィンガー方程式、

$$\frac{\partial}{\partial Z}A(Z,t) = \left\{ g(Z,t)\left(1 + \frac{1}{2\Delta\Omega_g^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) - L - q(Z,t) + i\frac{1}{2}\beta_2\frac{\partial^2}{\partial t^2} + i\delta|A(Z,t)|^2 \right\}A(Z,t)$$
(12)

をスプリットステップフーリエ変換法を用いて解くこと により,安定に連続波モード同期ができる条件 (^{*}₂₇A(Z,t)=0) を求めた.ここで,飽和(を考慮した)利得*g*(Z)であり(た だし,中心周波数),2.1の準3(4)準位レーザーの理論か ら得られる式を用いて不飽和単行利得を30dBとした.利 得媒質の応答(蛍光寿命~マイクロ~ミリ秒)に対してパ ルス波形の時間変化(フェムト~サブナノ秒)と繰り返し 時間(ナノ~サブマイクロ秒)が十分速いため,利得飽和 は瞬時パワーではなく平均パワーに依存するとした.利得 スペクトルは利得帯域幅2ΔΩ_aの放物線とした.

モード同期にはカーレンズモード同期を想定し,振幅変調は損失q(Z,t),可飽和損失 q_0 ,飽和パワー P_A の高速可飽和吸収体

$$q(Z,t) = \frac{q_0}{1 + \frac{|A(Z,t)|^2}{P_A}}$$
(13)

とし、自己位相変調の係数は δ である.また、分散は2次分散 β_2 のみを取り入れた.



Highly Nonlinear Medium





2・3 実験

理論の信頼性を確認するための実験構成を図3に示す. 利得媒質はYbイオン添加濃度20at.%,厚み1mmのマ イクロチップYb:YAGであり,共振器側の出力鏡側の端 面にレーザー・励起光に対する反射防止膜,共振器の端面 側(励起光源側)の端面にダイクロイック膜(励起光に対 する反射防止,レーザーに対する高反射膜)を蒸着してい る.また,共振器の端面側には冷却のために,反射防止膜 が蒸着されたサファイア結晶を光学接着剤で接着してい る.利得媒質はヒートシンクに取り付けられており,その 温度は室温(298 K)に制御されている.

励起光源はシングルエミッター型半導体レーザーであ り、ビーム品質の測定値は水平方向 $M_x^2 = 1.5$ 、垂直方向 $M_y^2 = 20$ であった.励起光の集光半径は、最小モード体積 のときの集光半径 $w_{px} = 12 \mu m$ 、 $w_{py} = 43 \mu m$ に対して、実 測値は $w_{px} = 10.5 \mu m$ 、 $w_{py} = 40.1 \mu m$ 、実験における最大 励起パワーは $P_n = 3.87 W$ (集光強度308 kW/cm²))とした.

結果および考察

3・1 レーザーの効率に関する解析

理論解析において,利得媒質の物性値は先行研究の値を 用いた.レーザー分布関数はビーム品質が水平方向,垂直 方向とも $M^2 = 1$ の TEM₀₀,集光位置は利得媒質の共振器 側の端面とした(集光半径水平方向 w_{lx} ,垂直方向 w_{ly}). 一方,励起分布関数は,集光位置はレーザーと同じく利得 媒質の共振器側の端面とした.水平方向と垂直方向のビー ム品質が M_x^2 , M_y^2 のガウシアンとした.

まず,シングルエミッター型半導体レーザー(ビーム品 質は測定値と同じ $M_x^2 = 1.5$, $M_y^2 = 20$)を励起光源とし た解析(図 4,5)を行なったところ,利得媒質の温度が 室温(298 K)のときの結果(図 5)を定量的に表すことが できた.これにより,一般に半導体レーザーの横モード(出 力ビームの強度分布)には複数の高次モードが含まれてい るため複雑であるが,本理論,すなわち,励起分布を測定 されたビーム品質をもつガウシアンと仮定した理論が定 量的にも信頼できることが明らかになった.また,従来は, 高密度励起には起因する熱光学歪の高さ(例えば,本実験 では熱レンズ焦点距離の最小値は 1 mm 以下)よる効率



図3. 半球共振器マイクロチップレーザーの概念図

の低下という欠点があると考えられていたが、これも十分 克服できることが明らかになった.

理論の信頼性が担保されたため、この半導体レーザーの ビーム品質と出力パワーの条件で励起光およびレーザー の集光径、出力鏡透過率などの最適化を行なったところ、 さらに効率を向上できることが明らかになった(残留損失 $L_i = 0.2\%$,励起光の集光半径 $w_{px} = 12 \mu m$, $w_{py} = 43 \mu m$ に対して、レーザー集光半径 $w_{lx} = 9 \mu m$, $w_{ly} = 59 \mu m$, で 光光変換効率 $\eta_{oo} = 76.4\%$ など).さらに、レーザーの集光 径が最適値からずれたとしても、効率の低下は低い(集光 径のずれが1割に対して効率低下は1ポイント%以内)こ とがわかった.従来、レーザーの効率向上には、励起光と レーザー光の横モードの幾何学的な重なりが重要である と考えられていたが、高密度励起の条件(かつ、高効率化 の最適条件下)では、幾何学的な重なりが効率に与える影 響は低いことが明らかになった.



図 4. マイクロチップレーザーの光光変換効率のレーザ ー集光半径(垂直 w_{lx} ,水平 w_{ly})依存性,励起光集光半 径 $w_{px} = 10.5 \mu m$, $w_{py} = 40.1 \mu m$,励起パワー $P_p =$ 3.87 W,出力鏡透過率T = 5%,残留損失 $L_i = 0.2\%$,利 得媒質の温度298 K,赤い破線は実験値



図 5. 半球共振器マイクロチップレーザーの入出力特性,赤丸は実験値,出力鏡透過率T = 5%,線はすべて理論値(レーザー集光半径 $w_{lx} \times w_{ly}$)

さらに、利得媒質の温度が室温 (298 K) に対して、398 K に上昇した場合の効率η₀₀の低下も7.4 ポイント%以下に 抑えることができた.一般に、イッテルビウムのような準 3(4)準位レーザーは、温度上昇によるレーザー下準位損失 の増大に起因して効率が低下することが知られている.例 えば、Yb:YAG (発振波長~1030 nm)の場合、従来の励 起密度(数10 kW/cm²のオーダー)では、10 Kの温度上昇 に対して効率が1割程度下がってしまう.つまり、従来の 励起密度の条件では、利得媒質の温度が室温に対して 100 Kも上昇すればほぼ発振しないと考えられる.これに 対して、本研究のように励起密度を向上させれば、温度上 昇に起因する効率低下を大きく抑制できることが明らか になった.この理由は、高密度励起による高利得化のため に、下準位損失に起因する効率低下を抑制できるためと考 えられる.

ー般にマイクロチップレーザーは冷却面積が狭く(数 mm²),かつ,励起領域と冷却面の間隔が広い(数 mm) ために冷却効率が低いという欠点がある.しかし,本研究 により,高密度励起が利得媒質の温度上昇に起因する効率 低下を抑制できることが明らかになった.これは,本実験



図 6. 光光変換効率のレーザー集光半径依存性,励起 パワー1.2 kW,励起光ビーム品質 $M_x^2 = 15$, $M_y^2 = 80$, 残留損失 $L_i = 2\%$,出力鏡透過率T = 21%最高効率時 の最適結合),利得媒質の温度298 K

で用いたように冷却のためにサファイアを接着しなくて も、効率の低下は殆ど無いこと(1ポイント%以下)を意 味している.

さらに、利得媒質として微細ロットや薄型スラブを用いれば、マイクロチップに対して冷却面積が桁違いに広く(数10~数100 mm²)、励起領域と冷却面の間隔が桁違いに高い、そこで、次に、平均出力の向上のために、励起パワーを向上させたときの解析を行った。励起光源は、最大出力120 Wのスタック型半導体レーザーを10 個重ねたスタック型半導体レーザー(つまり、最大出力1.2 kW)とした.このスタック型半導体レーザーのビーム品質は、リニアアレイ型(シングルエミッター型と同じビーム品質 $M_x^2 = 1.5$ を仮定)を10 個重ねているため、リニアアレイ型のビーム品質の10倍、つまり、 $M_x^2 = 15$ とした。また、遅軸側のビーム品質は、単位ビーム品質あたりのパワー(1 W/ M^2 と仮定)から、 $M_y^2 = 80$ とした.

まず,利得媒質の温度が室温(298 K),残留損失L_i = 1% のときの光光変換効率η_{oo}のレーザー集光半径依存性を図 6.に示す.最高の光光変換効率η_{oo} = 80.8%(最適出力鏡透



図 7. 光光変換効率のレーザー集光半径依存性, 励起パ ワー1.2 kW, 励起光ビーム品質 $M_x^2 = 15$, $M_y^2 = 80$, 残留損失 $L_i = 1$ %, 出力鏡透過率T = 21%(最高効率時 の最適結合)利得媒質の温度598 K

過率T = 21%,励起集光半径 $w_{px} = 37 \mu m$, $w_{py} = 86 \mu m$ レーザー集光半径 $w_{lx} = 66 \mu m$, $w_{ly} = 152 \mu m$)であり, レーザーの集光半径を数倍のオーダーで変化させても 80%以上の効率が得られた.また,図7に示すように利得 媒質の温度を 598K としたときの最高効率も 80%以上で あり,室温に対する低下も1ポイント%以下に抑えること ができた.

利得媒質に成膜されている誘電体多層膜の耐熱温度(~ 200℃)を考慮に入れると、利得媒質の現実的な温度は 498K 程度以下と考えられるため、598K という温度は非 現実的ではある.しかし、非現実的なまでに利得媒質の温 度を上げたとしても, 高密度励起により温度上昇に起因す る効率低下を抑制できることが明らかになった. さらに, レーザーの集光径を数倍のオーダーで変化させても効率 の低下を抑制できるということは,従来,高効率化に必須 とされていたが熟練の技術を必要としたレーザー共振器 の調整が容易になることを意味している. さらに, 励起光 とレーザーの幾何学的な重なりが小さくても効率に及ぼ す影響が少ないということから,従来は励起光を利得媒質 に導入するため必要であったダイクロイック膜の成膜が 必須ではないことを意味している.また、ブリュースター カットの利得媒質を用いれば,反射防止膜の成膜も必要と しない. これらの成果は、レーザーの製作のために熟練の 技術者を必要としないことや、利得媒質を単純化、かつ、 冷却機構も単純化できることを意味しており,高平均出力 レーザーのコストを下げることにつながると考えられる.

3・2 レーザーのパルス出力に関する解析

自己位相変調を用いずに、高速可飽和吸収体のみを用いた場合のパルス幅の飽和パワー依存性を図8に、飽和パワーを最適化した場合の最短パルス幅(図8の最短パルス幅(対応)の可飽和損失依存性を図9に示す.図8の黒い点線は発振スペクトルを利得スペクトルと同じ(ただし、利得が負になる周波数帯 $\sqrt{2}\Delta\Omega_g < |\Delta\varpi|$ の振幅をゼロとする)としたときのフーリエ変換限界パルス幅である.この発振スペクトル形状ではスペクトルが裾を引かずに($\sqrt{2}\Delta\Omega_g < |\Delta\varpi|$ で)ゼロであるために実際の利得スペクトルを発振スペクトルとしたときのフーリエ限界パルス幅(~120 fs)よりも広くなっているが、このパルス幅(黒い点線)が放物線状の利得スペクトルに対する最短パルス幅の限界の目安を示している.

これに対して、図 8 の赤は従来の変調と同じオーダーの 可飽和損失 $q_0 = 0.005$ の場合のパルス幅,青は高密度励起 により可能となった変調可飽和損失 $q_0 = 6$ の場合のパル ス幅であり、点は数値解析の値,破線と一点鎖線は、F.X. Kaertner らによる、高速可飽和吸収体のみを用いたとき パルス幅の近似式(Kaertner 近似)³⁾

$$\tau_{K} = \frac{1.76}{\Omega_{g}} \cdot \sqrt{\frac{l_{c} + q_{0}}{q_{0}}}$$
(14)

を用いて得られた値である.従来,このパルス幅が高速可 飽和吸収体のみを用いた場合の最短パルス幅を示してお り,かつ,このパルス幅は利得スペクトルの限界のパルス 幅よりも狭くならないと考えられていた³.

まず、従来のモード同期の条件である可飽和損失 $q_0 = 0.005$ のときの Kaertner 近似のパルス幅は、利得スペク



図 8. 高速可飽和吸収体のみを用いた場合のパルス幅の 飽和パワー依存性,利得スペクトルの形状は幅9 nmの 放物線,可飽和吸収体の損失を除いた共振器損失 1%, 赤は可飽和損失 $q_0 = 0.005$ (従来の損失変調と同じオー ダー),青は可飽和損失 $q_0 = 6$ (高密度励起により可能 となった値),点は数値解析の結果,破線と一点鎖線は Kaelter による近似式の値,黒い点線は発振スペクトル を利得スペクトルと同じ(ただし,利得が負になる周波 数帯 $\sqrt{2}\Delta\Omega_g < |\Delta \omega|$ の振幅をゼロとする)としたときの フーリエ変換限界パルス幅



図 9. 高速可飽和吸収体のみを用い,飽和パワーを最適 化した場合のパルス幅の可飽和損失依存性,利得スペ クトルは放物線,緑はスペクトル幅4.5 nm,他は9 nm, 破線と一点鎖線は発振スペクトルを利得スペクトルと 同じ(ただし,利得が負になる周波数帯 $\sqrt{2}\Delta\Omega_g < |\Delta \omega|$ の振幅をゼロとする)としたときのフーリエ変換限界 パルス幅, Toc は可飽和吸収体の損失を除いた共振器 損失



図 10. 自己位相変調と高速可飽和吸収体を用いた場合の パルス幅の飽和パワー依存性,利得スペクトルの形状は 幅 9 nm の放物線で周波数帯 $\sqrt{2}\Delta\Omega_g < |\Delta \omega|$ の利得はゼ ロ,共振器内部の分散は 2 次分散のみ ($\beta_2 = 2000 \text{ fs}^2$), 可飽和吸収体の損失を除いた共振器損失 20%,可飽和損 失 $q_0 = 6$ (高密度励起により可能となった値),青の四角 は出力パルス幅, 橙の菱形はフーリエ限界パルス幅

トルの限界となるパルス幅(黒い点線)よりも広く,かつ, 数値解析における最短パルス幅も,Kaertner 近似(赤い 一点鎖線)よりも広く,従来の常識通りの結果を示してい る.これに対して,可飽和損失q₀ = 6の場合のパルス幅に ついては,Kaeltner 近似のパルス幅(青い破線)は利得 スペクトルの限界よりも狭く,かつ,数値解析における最 短パルス幅は更に狭くなっていることが分かる.これらの 結果は,高速可飽和吸収体を用いるだけでは利得スペクト ルの限界のパルス幅を超えることができないという常識 を覆すものである.

次に,高速可飽和吸収体に加えて自己位相変調も用いた ときのパルス幅の飽和パワー依存性を図 10 に示す.高非 線形材料を用いて自己位相変調と分散を制御することに より,利得帯域の限界を大幅に超える超短パルス化が可能 であることがわかる.

3. まとめ

本研究では、高出力超短パルスレーザーの理論を構築し、 この理論を用いて単純化および低価格化を実現するため の手法を開発した.まず、単位出力あたりの価格が安価な エッジエミッター型半導体レーザーを用いて高密度励起 することにより、レーザー共振器の精密な調整を必要とせ ずに量子限界に近い高効率化とキロワットクラスの高出 力化を実現できることを明らかにした.また、従来は問題 と考えられていた、高密度励起に起因する光学歪や半導体 レーザーの低ビーム品質や高収差に起因する効率低下も、 高密度励起により克服できることを明らかにした.

出力パルスに関しては、連続波モード同期固体レーザー の共振器内部に高非線形性材料を挿入して自己位相変調 と分散を制御し、可飽和吸収を最適化することにより利得 帯域の限界を大幅に超える超短パルス化ができることを 明らかにした.さらに、モード同期の損失変調を従来より も極めて高くすることにより、自己位相変調を用いずに高 速化飽和吸収体だけを用いた場合でも、利得帯域の限界を 超える超短パルス化ができることを明らかにした.可飽和 吸収体によるモード同期は、カーレンズモード同期よりも 共振器の調整や分散の制御が容易であるため実用性が極 めて高い.これらの成果は、高出力超短パルスレーザーの 単純化および低価格化につながるものである.

謝 辞

本研究は,福井大学光エレクトロニクス研究室の学生 (前田氏,青柳氏,柴田氏,川嶋氏,韓氏,後藤氏,上島 氏,木藤氏,戸谷氏,小川氏,稲葉氏,片岡氏)の協力の 下に行われました.本研究は天田財団の助成を受けました.

参考文献

- M. Shibata, T. Kawashima, M. Yamashita, S. Kawato, Theoretical analysis of high efficiency bluelaser-diode-pumped Ti:sapphire laser by high intensity pumping, Laser Physics Letters, 2021, 105001(9 pp.).
- S. Kawato, T. Kawashima, High-efficiency continuouswave Ti:sapphire laser with high-intensity pumping using a commercially available crystal, Applied Sciences, 2022, 4815 (18 pp.).
- F. X. Kaeltner, J. A. Au, U. Keller, Mode-locking with slow and fast saturable absorbers-what's the difference, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 1998, 4, 2, 159-168.